WS 2014/2015 Ausgabe am: 05.12.2014

Übungsblatt 8

Aufgabe 1) pn-Diode

Eine ideale, lange pn-Siliziumdiode ist auf der n-Seite ($x \ge 0 \mu \text{m}$) mit $n_{_D} = 10^{18} \, \text{cm}^{-3}$, auf der p-Seite mit $n_{_A} = 5 \cdot 10^{18} \, \text{cm}^{-3}$ mit abruptem Übergang bei $x = 0 \mu \text{m}$ dotiert. Die Eigenleitungsträgerdichte beträgt $n_{_i} = 1, 5 \cdot 10^{10} \, \text{cm}^{-3}$, die Dielektrizitätskonstante $\varepsilon_{_T} = 12$, die Minoritätsträgerlebensdauern sind $\tau_{_n} = \tau_{_p} = 1 \mu \text{s}$, die Diffusionskonstanten betragen $D_{_n} = 23 \, \text{cm}^2 \text{s}^{-1}$ und $D_{_p} = 12 \, \text{cm}^2 \text{s}^{-1}$. Führen Sie alle Rechnungen in eindimensionaler Näherung bei $T = 300 \, \text{K}$ unter der Annahme von Störstellenerschöpfung durch.

- a) Berechnen Sie Diffusionsspannung U_D und die Gesamtlänge l der RLZ ohne angelegte Spannung. Nehmen Sie hier Schottky-Näherung an.
- b) Die Diode wird nun mit einer Durchlass-Spannung von $U=0,61\mathrm{V}$ betrieben. Berechnen Sie die Minoritätsträgerdichten an den Rändern der Raumladungszone. Skizzieren Sie den Verlauf der Minoritätsträgerdichten außerhalb der RLZ.
- c) Berechnen Sie die Position $x_{n,BG}$, bei der im n-dotierten Teil der Diode das n-Bahngebiet beginnt. Der Beginn des Bahngebietes ist so definiert, dass die Überschuss-Minoritätsträgerdichte p' an dieser Position genau den Wert der ungestörten Minoritätsträgerdichte p_{n0} annimmt. Vergleichen Sie die Länge des Diffusionsgebiets mit der Länge der RLZ.
- d) Berechnen Sie die stationäre Löcherverteilung p_n als Funktion von x in der RLZ des n-Gebietes. Nehmen Sie an, dass das Quasi-Fermi-Niveau W_{Fn} für Elektronen in der RLZ konstant ist und verwenden Sie den in der Vorlesung hergeleiteten Verlauf des Potentials $\varphi(x)$. Erläutern Sie, wie dieses Ergebnis mit den Annahmen der Schottky-Näherung in Einklang zu bringen ist.
- e) Skizzieren Sie die Elektronen- und Löcherdichten als Funktion des Ortes x über das gesamte Bauteil für die folgenden Fälle:
 - i. Ohne externe angelegte Spannung U = 0.
 - ii. Für eine extern angelegte Durchlassspannung U > 0, wobei $U < U_D$
 - iii. Für eine extern angelegte Sperrspannung U < 0.

Verwenden Sie für die Ordinate einen logarithmischen Maßstab.

f) Berechnen Sie die Löcherstromdichte und die Elektronenstromdichte bei $x=30\,\mu m$ für den in Aufgabenteil b) angegebenen Vorwärtsbetrieb.

Bitte wenden →

Aufgabe 2) Zenerdiode

Bei pn-Übergängen in Silizium ($n_i=1.5\cdot 10^{10}\,\mathrm{cm}^{-3}$, $\varepsilon_r=12$) kommt es typischerweise bei Feldstärken von ca. $5\cdot 10^5\,\mathrm{V/cm}$ zu einem Zenerdurchbruch. Im Folgenden soll ein pn-Übergang in Silizium betrachtet werden mit den Dotierungsdichten $n_\mathrm{A}=1\cdot 10^{18}\,\mathrm{cm}^{-3}$ und $n_\mathrm{D}=3\cdot 10^{17}\,\mathrm{cm}^{-3}$.

- a) Berechnen Sie die Durchbruchspannung des Bauteils bei Raumtemperatur T = 300K.
- b) Kommt es bei dieser Spannung tatsächlich zu einem Zenerdurchbruch und nicht etwa zu einem Lawinendurchbruch? Begründen Sie Ihre Antwort mit Fig. 2.

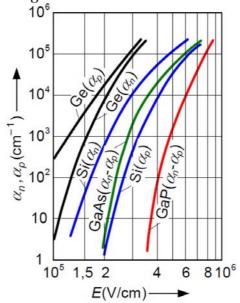


Fig. 2: Gemessene Ionisationskoeffizienten für Lawinenmultiplikation als Funktion der Feldstärke. (aus Müller, R.: Grundlagen der Halbleiter-Elektronik, Springer, 1984)